UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

"INFLUENCIA DE IMPUREZAS DIVALENTES EN LA FORMACION Y CRECIMIENTO DE CENTROS F"

INSTITUTO DE FISICA



BIBLIOTECA JUAN B. DE OYARZABAL

T E S I S Que para obtener el grado de: DOCTOR EN FISICA p r e s e n t a EDUARDO MUÑOZ PICONE

C. U., MEXICO, D. F.

2 4 3



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. A la memoria de mi padre

計算法 詳

A Graciela, Eduardo y Mónica

A mi madre

INDICE

			Página
		Introducción	1
CAPITULO	I	Defectos. Centros F.	4
п	II	Termoluminiscencia.	17
"	III	Experimento.	28
"	IV	Resultados y conclusiones.	37
		Agradecimientos.	52
		Referencias.	53

INTRODUCCION

ė.

El propósito de este trabajo es reportar los resultados de un estudio sistemático, realizado por medio de ---Absorción Optica y Termoluminiscencia, de la influencia de impurezas divalentes, en particular Ca²⁺, Cd²⁺, Cu²⁺, Mg²⁺, Mn²⁺y Zn²⁺, en la formación y crecimiento de centros F en monocristales de Cloruro de Sodio.

Durante los últimos años se ha discutido mucho sobre el papel que juegan las impurezas divalentes en la forma-ción y crecimiento de centros F en los halogenuros alcalinos y a la fecha no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su efecto. Sigue sin entenderse por qué impurezas del tipo Ca^{2+} y Cd^{2+} , tan semejantes desde muchos puntos de vista, producen efectos tan diferentes.

Existen varios métodos para producir centros de color en cristales, y entre la gran variedad de centros de color que se proponen, el centro F, cuyo modelo actualmente - aceptado es el de un electrón atrapado en una vacancia de ión negativo, se cree es la imperfección más simple de todas, por lo que para tratar de entender el papel que tienen los defectos de este tipo en los cristales se haya dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su estudio.

Los resultados experimentales muestran que los cris tales reales tienen una gran variedad de defectos que -influencían sus propiedades físicas de una manera notoria. Lo que se espera es producir cristales con número contro lado de defectos conocidos y estudiar cuantitativamente la influencia de estos defectos sobre las propiedades de los cristales iónicos.

El utilizar conjuntamente los métodos de Absorción -Optica y Termoluminiscencia, tomando en cuenta que con éste último se pueden estudiar estados de atrapamiento en cristales, tiene por objeto correlacionar el llenado y vaciado de las trampas "Termoluminiscentes" con cambios en las bandas de absorción óptica.

En el primer capítulo se presentan las propiedades ópticas de los halogenuros alcalinos, la forma en que las impurezas divalentes modifican la red cristalina normal y las propiedades ópticas de la banda F.

En el capítulo II se discuten las propiedades de -termoluminiscencia de este tipo de cristales y se presenta el modelo utilizado para calcular las energías de activa ción (profundidad de trampa).En el capítulo siguiente se -

presenta el método experimental y en el capítulo final los resultados obtenidos y las conclusiones que se considera están corroboradas por los resultados mismos.

CAPITULO I

DEFECTOS.

CENTROS F.

De extraordinaria importancia para el estudio de centros de color es el amplio intervalo de transparencia óptica que muestren los halogenuros alcalinos. Son tran<u>s</u> parentes desde el ultravioleta (10^3 Å) hasta el lejano infra-rojo (5×10^4 Å). La absorción ultravioleta corres-ponde a transiciones electrónicas entre bandas (valencia y conducción) o entre la última banda llena y los niveles de excitón, mientras que la infra-roja se relaciona con las vibraciones de los iones que constituyen el sólido -cristalino. En consecuencia, existe una región espectral muy amplia en la cual los cambios en la absorción óptica pueden estudiarse y detectarse con relativa facilidad.

Muchas impurezas químicas, cuando se les introduce -

en este tipo de sólidos, aún en concentraciones de partes por millón, evidencian su presencia introduciendo bandas de absorción en la región espectral que es normalmente -transparente. De igual manera los defectos y centros debidos a otras causas, tales como; deformación mecánica, irra diación X, & y otros, dan lugar, ya sea a una extensión hacia longitudes de onda larga de la "cola" de las prime-ras bandas de absorción ultravioleta o a nuevas bandas --discretas de absorción en la región de transparencia nor--mal.

Las propiedades ópticas y eléctricas de los halogenuros alcalinos indican que se pueden describir como aisla-dores típicos dentro del esquema de bandas con una región prohibida del orden de 8 eV., dependiendo del material base de que se trate. Un diagrama usual de este tipo de --cristales se muestra en la figura 1.



Fig. 1.

Como la banda de valencia (BV) se debe a los electrones de valencia de los iones halógenos, y habíamos mencionado que la absorción de luz en la región del ultravioleta corresponde a la liberación de electrones desde la banda de valencia a la de conducción, esto significa que queda una deficiencia de electrón en la banda de valencia, a lo cual se le denomina "hoyo" o "agujero" y se le considera carga eléctrica positiva y de magnitud idéntica a la del electrón. Desde el punto de vista químico, un agujero en el ion halógeno transforma el ion (que es normalmente ne gativo) en átomo:

$X^{-} + h = X^{\circ}$.

Debido a que el electrón liberado y el agujero resultante son libres de moverse, debe resultar fotoconductividad de este proceso. For otro lado, si se absorbe luz en la re gión de mayor longitud de onda de la banda ultravioleta, no se presenta fotoconductividad. Esto se explica bajo la suposición de que el electrón y agujero permanecen "ama rrados" por atracción coulombiana, ya que la luz de esta longitud de onda no es lo suficientemente energética para separarlos. A esta entidad eléctricamente neutra, que puede verse como una partícula libre de moverse por el cris tal transportando energía, se le denomina "excitón" (niveles \in en la figura 1). Los excitones se pueden considerar debidos a la excitación de electrones de valencia de los iones halógenos por absorción de luz, esto es $X \xrightarrow{h Y} X^{-*}$.

El ion halógeno excitado X^{**} puede transferir su energía a un ion vecino X⁻, y la energía puede "viajar" por el cristal. También los estados de excitación se pueden con siderar debidos a un proceso por el cual al absorberse luz hay transferencia de un electrón de un ion halógeno al ion alcalino vecino.

$$M^+ + X^- \xrightarrow{hv} M^\circ + X^\circ$$
.

El electrón en el ion alcalino y el agujero en el ion hal<u>ó</u> geno permanecen ligados por fuerza coulombiana y el par l<u>i</u> gado puede moverse al desplazarse (agujero y electrón) a iones alcalinos y halógenos vecinos.

La absorción de luz de alta energía, en cualquier modelo que se considere, resulta en ionización del elec trón de valencia, de manera que el electrón y agujero son completamente libres uno de otro.

La adición de impurezas en halogenuros alcalinos, o la creación de centros de color por los diversos procesos que se conocen^{1,2}, da lugar a niveles energéticos locali zados en la región prohibida. (Ver figura 1). Las bandas de absorción observadas, ya sea de impurezas (A en la fig. 1) o centros de color (F y V en la fig. 1) implican excitaciones electrónicas entre estos estados localizados o entre uno de estos estados y las bandas de conducción y valencia.

En cualquier cristal se esperan defectos Schottky y -

Frenkel (figura 2) debido a causas puramente termodinámi cas³. Sin embargo, debido al mayor radio de los iones ne gativos, la energía requerida para colocarlos en posicio nes intersticiales es considerablemente mayor que la reque rida para colocar iones positivos en las mismas posiciones. En consecuencia, y como regla general, se espera formar fácilmente defectos Frenkel con iones positivos. De la misma menera, para un cristal dado, habrá una diferencia entre la energía requerida para formar un defecto Frenkel y la requerida para formar un defecto Schottky. En última instancia, el tipo de defecto que predomine en un cristal dado, es aquel que requiera la minima energía de formación. Los cálculos para las energías de formación de estos dos tipos de defectos indican que los defectos de Schottky predominan si se cumplen las siguientes condiciones: igual dad de tamaño en iones positivos y negativos, constante dieléctrica baja y contribución pequeña de Van der Waals a la energía de la red. Los halogenuros alcalinos son cris tales de este tipo. Por otro lado, los cálculos indican que se requiere del orden de l eV., más para formar un defecto Frenkel que uno Schottky, en este tipo de cristales.

No sólo térmicamente es posible tener o producir defectos, sino también por la adición de impurezas. Un ejemplo de este efecto se muestra en la figura 3, donde algunos de los iones positivos han sido reemplazados al -



Fig. 2

Fig. 3. (++) -- Ion divalente substitucional. + -- Vacancia de ion positivo.

azar por impurezas de ion divalente positivo. La substitución antes mencionada da una carga positiva extra en el cristal. Para preservar la neutralidad eléctrica del mismo como un todo, se debe formar una vacancia de ion positivo en un punto de la red. Esto último implica que una vacan cia de ion positivo tiene una carga efectiva negativa. De manera semejante, una vacancia de ion negativo tiene una carga efectiva positiva. Esto último, o sea que las vacancias (y iones intersticiales) son regiones de carga no-balanceada en el cristal, causa interacción electrostática entre los dos defectos dando por resultado la formación de vacancias dobles o "pares". Esta energía es del orden de 1 eV., para NaCl y se espera una gran concentración de "pares" De igual manera se espera que los defectos producidos debi do a la adición de impurezas divalentes se asocien en lo que se denomina "complejos" que están constituídos por la impureza y el defecto en sitios adyacentes de la red cristalina. Existe evidencia teórica y experimental de que tales complejos realmente existen^{5,6}, y de que al mantener un cristal que los contenga a alta temperatura se presenta disociación de los mismos dando como resultado vacancias -"libres" y otro tipo de defectos.

Teniendo presente el hecho de que los defectos se comportan como entidades con carga eléctrica efectiva, tienen la propiedad de atraer y aún "amarrar" electrones y agujeros que haya en el cristal debido a algún proceso que

los genere. Se supone que se forman electrones y agujeros en igual número. En el caso que se irradíe un cristal con rayos X, se liberan electrones de algunos de los iones -del cristal. De estos electrones la mayoría se recombinan rápidamente con agujeros y se puede pensar que los electro nes regresan a los iones de donde salieron. Sin embargo, puede ocurrir que un electrón se atrape en un defecto ---"cargado" positivamente y, desde luego, también puede ocurrir que alguno o varios agujeros se atrapen en defectos -"cargados" negativamente. De aquí el nombre "trampa" para un átomo o defecto capaz de capturar un electrón o un --agujero. De manera muy general podemos definir un centro de color como una trampa que absorbe luz visible. Una va-cancia no produce color en un halogenuro alcalino, pero -una vacancia de ion negativo que ha atrapado un electrón si lo produce. A esto es a lo que se denomina un centro F, en el modelo originalmente propuesto por de Boer7 :este se considera el centro de color más sencillo. Actualmente se considera el modelo de de Boer el más adecuado para la -interpretación de los fenómenos asociados con el centro F. Esto es así en virtud de que el modelo es consistente con varios resultados experimentales, entre los cuales podemos citar; a) al calentar cristales a alta temperatura en presencia de algún metal alcalino (no necesariamente el mismo del que está constituído el cristal) y enfriarlos rápida -mente a temperatura ambiente, muestran una banda de

absorción en el visible que se identifica plenamente con la banda F. Además, por análisis químico se encuentra que estos cristales contienen del orden de 10¹⁶ a 10¹⁹ átomos/cm3 en exceso con respecto a los del metal alcalino, b) los cristales que contienen centros F presenten menor densidad que los que no los contienen. lo cual concuerda con la suposición de que la introducción de vacancias debe disminuir la densidad, c) la misma banda de absorción se forma cuando los cristales se irradian con luz ultravioleta, rayos X, y otros tipos de radiación que se supone -que producen electrones que finalmente se atrapan en las vacancias de ion negativo, y d) el resultado de resonancia paramagnética electrónica, con el cual se ha identificado la estructura del centro F^{8,9}. Además, de los resultados se concluye que el electrón se encuentra principalmente -entre los seis iones alcalinos adyacentes a la vacancia -del ion negativo. Por lo mencionado previamente, en este trabajo se supone que un centro F es un electrón atrapado en una vacancia de ion negativo. Esto se supone, desde -luego, sin implicar nada con respecto al grado de localiza ción del electrón. El electrón puede estar confinado total mente a la vacancia del ion negativo, puede estar distri--buído entre los seis iones alcalinos más próximos, o aún puede distribuírse a otros iones vecinos. Aquí es conve--niente mencionar que los resultados de resonancia paramagnética muestran que la densidad de la nube electrónica, en

los seis vecinos más próximos que rodean la vacancia, es seis veces mayor que en los doce vecinos próximos.

En halogenuros alcalinos nos interesa, en particular, la producción de centros F a temperatura ambiente. Al irr<u>a</u> diar estos cristales con rayos X se encuentra que la abso<u>r</u> ción más intensa es la correspondiente a la banda F. En -cloruro de sodio esta banda presenta su máximo a 4650 Å -(2,67 eV.) y el ancho a la mitad de la altura de la curva de absorción es aproximadamente igual a 0.5 eV.

Si se supone que los centros que producen la absor--ción no interaccionan entre si, el área bajo la curva de absorción es proporcional a la concentración de centros. -Smakula¹⁰, tratando los centros como osciladores amortigu<u>a</u> dos de acuerdo con la teoría clásica de dispersión, llega a una expresión para calcular la densidad de centros. La fórmula que usamos en este trabajo es la debida a Dexter¹¹ en la que se toma en cuenta el hecho de que el ancho de la banda de absorción se debe a interacciones de los centros con las vibraciones de la red así como el carácter gaussi<u>a</u> no de la curva de absorción. Esta expresión queda dada por:

$$N = 0.87 \times 10^{17} \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \frac{d_m W}{f}$$
(I-1)

en donde N es el número de centros por cm³, f es la intensidad del oscilador, n el indice de refracción del cristal α'_m el coeficiente de absorción en el máximo de la curva de de absorción (cm⁻¹) y W el ancho de la linea de absorción a la mitad de la altura (eV.).

Se le llama curva de crecimiento de centros F a la de pendencia de la concentración de centros con la dosis o el tiempo durante el cual se somete el cristal a irradiación. En casi todos los materiales la curva de crecimiento se ve influenciada por una gran variedad de factores, los más importantes de los cuales parecen ser : a)la cantidad de impurezas contenidas en el cristal, b)la intensidad de irradiación y c) la deformación plástica. Desde el punto de vista del presente trabajo lo que nos interesa es el primer inciso y, en particular, la influencia de impurezas divalentes, en lo que se denomina la primera etapa de formación de centros F , ya que se ha encontrado que los centros F se generan en dos etapas, cuando los cristales son irradiados con rayos X. La concentración de centros F en la primera etapa^{12,13}se satura en unas cuantas horas mientras que en la segunda sigue creciendo con el tiempo de irradiación. Se cree que los centros F iniciales se forman por las vacancias presentes en el cristal antes de someter lo a irradiación, las cuales se consideran distribuídas estadísticamente en el cristal. Los centros generados en la segunda etapa, se forman por vacancias producidas duran te el proceso mismo de irradiación y se encuentran en re giones aisladas de alta concentración local. Además, algunos autores encuentran que la primera etapa es favorecida por la presencia de impurezas divalentes positivas14,15.

En particular se encuentra que algunas impurezas favorecen la formación de centros F $(Ca^{2+})^{1/1,16}$, 17 mientras que -otras $(Cd^{2+})^{16}$, 18 la inhiben.

Esta discrepancia en el proceso de generación de centros F, como función de las impurezas divalentes adicionadas, hace que el mecanismo de producción sea muy difícil de predecir. Hasta ahora se han propuesto varios mecanis mos para tratar de explicar la formación y el crecimiento de centros F. Crawford y Nelson¹⁹ proponen que las vacancias de ion positivo creadas por las impurezas diva lentes adicionadas no permanecen asociadas con la impureza, sino que son vacancias "libres" y se convierten en centros F, cuando el cristal se irradía con rayos X. Tal proceso tiene lugar cuando un ion negativo advacente a la vacancia de ion positivo captura un agujero y este "átomo" pasa a ocupar el lugar de la vacancia. Este proceso implica un crecimiento en el número de centros F. debido a las vacancias cargadas positivamente que se crean, independiente mente del tipo de impureza divalente de que se trate.

Para tratar de discernir el mecanismo de producción de centros F, en el presente trabajo vamos a correlacionar las medidas de absorción óptica con las de termoluminis cencia, ya que, como veremos en el siguiente capítulo, el proceso de termoluminiscencia involucra trampas, centros luminiscentes y la transferencia de electrones o agujeros entre las trampas y los centros luminiscentes. De estos -

s,

estudios creemos que es posible conocer la estructura atómica de la trampa y del centro luminiscente y deducir si un electrón o un agujero es el que se transfiere entre -ellas. CAPITULO II TERMOLUMINISCENCIA

Los cristales que han sido irradiados a temperatura ambiente presentan una tendencia a ser luminiscentes si se eleva su temperatura hasta un valor suficientemente alto.-La ocurrencia de esta termoluminiscencia, consecuencia de la irradiación, se debe a los electrones que pasan a estados metaestables de energía relativamente alta (trampas); de estos, pasan a un nivel más alto como consecuencia del proceso de activación térmica y finalmente, a un estado es table, a través de una transición óptica, en el curso de la cual toda o parte de su energía se convierte en luz.

En un aislador, antes de irradiarlo, la situación es tal que una banda de energía está totalmente llena mien -tras que la siguiente (en energía) está totalmente vacía. Entre estas bandas se supone que existen dos tipos de nive les localizados; los asociados con diferentes tipos de -- trampas, que normalmente no están ocupados por electrones, y aquellos asociados con distintos tipos de imperfecciones (átomos de impureza) que contienen electrones y los retienen, siempre y cuando la banda inferior esté totalmente -llena. Llamaremos N₁ a los niveles que sirven de trampas para electrones y P_j a los correspondientes a electrones en átomos de impureza, niveles de luminiscencia.

Al irradiar el cristal, la situación es tal que, pa san electrones de la banda llena a los niveles N_1 , dejando "agujeros" en dicha banda. El siguiente paso es la recom-binación de electrones de los niveles P_j con los agujeros mencionados. Al producirse el proceso de activación térmica (termoluminiscencia), los electrones atrapados en N_1 pa san a la banda de conducción de donde regresan a los niveles P_1 emitiendo luz.

Desde luego, la cinética del proceso de termoluminiscencia puede ser muy complicada, puesto que, además de los niveles N₁ y P_j, pueden existir estados localizados de menor energía asociados con un cierto nivel de atrapamiento, algunos de los cuales pueden conectarse con niveles N₁ por transiciones sin radiación.

Para tratar de explicar el proceso de termoluminiscen cia se han propuesto varios modelos. Randall y Wilkins²⁰ fueron los primeros, usando un modelo en el cual los electrones en estados metaestables, pasan térmicamente a un -estado excitado del que regresan al estado base con emi---

sión de TL (termoluminiscencia). Suponiendo calentamiento a velocidad constante y proceso monomolecular obtienen una expresión para la variación de la TL con la temperatura. -En modelos posteriores^{21,22} se extiende la teoría para tra tar procesos bimoleculares y el caso de reatrapamiento de los electrones liberados; sin embargo, el cálculo de las energías de activación (profundidad de la trampa) utilizan do estos modelos, es bastante complejo, tanto por razones físicas como matemáticas. La dificultad está en el hecho de que, además de la energía de activación, las ecuaciones contienen otros parámetros: el llamado factor de frecuen cia de la trampa y las probabilidades de transición invo lucradas. Es claro que los modelos que se han propuesto posteriormente para tratar de eliminar estas dificultades tienen ciertas limitaciones, pero nos permiten, de una manera más o menos simple, calcular ciertos parámetros a par tir de las curvas experimentales.

Halperin y Braner²³ desarrollan un método de cálculo en el que se hace uso de las propiedades de simetría de las curvas de termoluminiscencia. Demuestran que la sime tría no sólo depende de las probabilidades de transición involucradas, sino también, del número de trampas comparado con el de centros luminiscentes.

En virtud de que este modelo es el que usaremos para el cálculo de las energías de activación para los crista les analizados en el presente trabajo, daremos un breve re

sumen del método.

El modelo admite un cierto número de niveles localiza dos en la región de energía prohibida (ver figura 4). N₁ es el número de trampas de electrones por unidad de volu men, a profundidad E₁; n₁ es el número de ellas ocupadas por electrones, P_j, E_j y p_j son las cantidades correspon dientes para agujeros.

En términos de este modelo, se entiende por excitar el cristal, el proceso de pasar electrones de la banda de valencia, (o directamente, desde las trampas N₁) a la banda de conducción, seguido del atrapamiento de los electrones en los niveles N₁. Al mismo tiempo, los agujeros "crea dos" en la banda de valencia, son atrapados en los niveles Pj. Se supone en este modelo que las energías E₁, E_j son mucho mayores que kT, donde k es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. Bajo estas condiciones, el nú mero de electrones en la banda de conducción y de agujeros en la de valencia será muy pequeño comparado con el corres pondiente número en las trampas y centros. La condición de neutralidad de carga del cristal, se expresa en la forma:

 $\Sigma n_i = \Sigma P_j$.

Elevar la temperatura del cristal significa liberar electrones de las trampas y el subsiguiente proceso de recombinación. Es conveniente aclarar que aún cuando en el modelo se supone que son electrones los que se liberan tér micamente, los cálculos son aplicables al caso análogo en







el cual son agujeros los que se liberan térmicamente.

Se supone además, que en el intervalo de temperaturas que se considera, sólo un nivel de atrapamiento a "profundidad" E (concentración N) es el que efectivamente libera los electrones, y que la recombinación tiene lugar solamen te en un tipo de centro luminiscente P, lo cual da lugar obviamente a un solo pico de termoluminiscencia. Un punto importante en el modelo es que, aunque no se consideran transiciones correspondientes a otros niveles de atrapa---miento, tales trampas existen y pueden ser ocupadas. Esto afecta la condición de neutralidad, la cual debe ahora expresarse en la forma:

$$\Delta n = \Delta P \qquad (II-1)$$

donde $\Delta n = n_0 - n_y \quad \Delta P = P_0 - P$ (II-2) En esta relación N_0 , P_0 son las concentraciones a un tiem po t_o y N, P al tiempo t, de electrones y agujeros atr<u>a</u> pados, respectivamente.

En su trabajo, Halperin y Braner, discuten dos sub-modelos del modelo presentado anteriormente. El que consideramos de utilidad para este trabajo, es el que llaman submodelo II, en el cual se supone que el electrón atrapado pasa directamente a la banda de conducción, donde puede moverse con velocidad media u y finalmente se recombina con un agujero atrapado. También se toma en cuenta que la densidad de estados en la banda de conducción depende de la temperatura, a través de la relación²⁴ $5_{6n} = HT^2$,

donde d_n es la sección para reatrapamiento, s el factor de frecuencia y H una constante.

Una vez que el electrón pasa a la banda de conducción, la trampa que ha dejado no se puede distinguir de otras del mismo tipo. Las ecuaciones que describen la cinética del proceso están dadas por;

$$-\frac{dP}{dt} = Pn_{c} A_{P}$$

$$-\frac{dn}{dt} = fn - n_{c} (N-N) A_{n} \qquad (II-3)$$

$$\frac{dn_{c}}{dt} = fn - n_{c} [PA_{P} + (N-n)A_{n}]$$

en donde, n_c es la concentración de electrones en la banda de conducción, A_p la probabilidad de recombinación, A_n la probabilidad de reatrapamiento y $\chi = \leq \mathbb{C}$ es la pro--babilidad para excitación térmica. Si se supone que la recombinación es suficientemente rápida, n_c es suficiente---mente pequeña y autoconsistentemente podemos suponer, en la última de las ecuaciones (II-3), que $\frac{dn_c}{dt} = 0$.

De estas relaciones obtenemos:

$$-\frac{d\theta}{dt} = gn \frac{A_{\theta}\theta}{(N-n)A_{n} + \theta A_{\theta}} \cdot (11-4)$$

De (II-2) se tiene $N = P_{\circ}(a + \mu - 1)$ (II-5) en donde $\mu = P_{\circ} p_{\circ} q = \frac{N_{\circ}}{\rho_{\circ}}$.

Por otro lado, la intensidad de termoluminiscencia está dada por:

$$I = -\frac{d\theta}{dt}$$
(II-6)

y si se considera calentamiento a velocidad constante - $dT = \beta dt$, resulta:

$$I = -\beta^{0} \frac{d\mu}{d\tau}$$
 (II-7)

De las expresiones (II-4) y (II-7), obtenemos:

$$-\frac{d\mu}{dT} = \frac{\mu(a+\mu-1)}{A^*\mu+B^*}\left(\frac{Ae^*}{l^3}\right) = \frac{I}{PP_o} \quad (II-8)$$

donde, $\mathbf{A} = \mathbf{A}_p - \mathbf{A}_n$, $\mathbf{B} = \mathbf{A}_n(\mathbf{x} - \mathbf{x} + \mathbf{1})$ y $\mathbf{x} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{n}_o}$.

En este punto es donde se introducen las características de las curvas de termoluminiscencia que se obtienen experimentalmente. Los parámetros que se utilizan se in-dican en la figura 5, que muestra una curva típica de -termoluminiscencia. Se introduce $\delta = T_a - T_m$; T_a es la temperatura a la mitad de la intensidad en el lado de alta temperatura de la curva y T_m la temperatura a máxima intensidad. Se obtiene entonces:

$$P_{m} = \int_{t_{m}}^{\infty} I dt = \frac{1}{p} \int_{T_{g}}^{\infty} I dT \approx \frac{1}{p} I_{m} \delta \qquad (II-9)$$

Aquí el indice m se refiere a valores tomados en el máximo de la curva de termoluminiscencia y el área bajo el pico a la derecha de T_m se ha aproximado por un triángulo, -aproximación que experimentalmente da un error menor del 5%.

Tomando en (II-8) la derivada con respecto a la tem-peratura e igualando a cero en el máximo del pico, obtenemos mediante el uso de (II-9) una expresión para la energía de activación

$$E = q_m \frac{k T_m}{\delta} (1 - \Delta), \qquad (II-10)$$

 $q_{m} = \frac{B^{*}}{A^{*}\mu_{m} + B^{*}} + \frac{\mu_{m}}{(\mu_{m} + d - 1)}$ (II-11)

$$\Delta = \frac{2 k T_m}{E}$$
(II-12)

Este último factor (Δ) es simplemente una corrección a la energía calculada y el parámetro q_m depende de la forma de la curva de termoluminiscencia y de la cinética del proceso.

Con el objeto de calcular la energía de activación en casos específicos, tales como : a) recombinación dominante, $\stackrel{*}{A} >> \stackrel{*}{B}$, b) probabilidades de recombinación y de reatrapamiento iguales, $A_p = A_n$, y c) reatrapamiento dominante, $A_n >> A_p$, es necesario tener una relación entre - A^* , B^* y M_m . Esta relación se obtiene integrando la expresión (II-8), de lo cual resulta;

$$\ln\left[\left(\frac{\mu+d-1}{\mu}\right)^{A^{*}-}\mu^{A^{*}}\right] = -\frac{A_{e} \leq_{n} H}{\beta} J^{*} (II-13)$$

con

donde

$$J = \int_{T_{o}}^{T^{2}} exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dT \approx \frac{kT^{4}}{E} exp\left(-\frac{E}{kT}\right)(1-2\Delta) (II-1/4)$$

donde la aproximación²⁵ es válida para E>>kT. Usando esta aproximación y las expresiones (II-10) y (II-11) en -(II-13) se tiene;

$$ln\left[\left(\frac{\mu_{m+d-1}}{\mu_{md}}\right)^{A^{*}-B^{*}_{d-1}}\mu_{m}^{A^{*}}\right] = \frac{\left(A^{*}_{\mu_{m}}+B^{*}\right)^{2}\left(1-\Delta\right)}{\left(1-\Delta\right)}$$

$$= -\frac{\left(A^{*}_{\mu_{m}}+B^{*}\right)^{2}\left(1-\Delta\right)}{\mu_{m}\left(A^{*}_{\mu_{m}}+2B^{*}\right)+\left(d-1\right)B^{*}}$$
(II-15)

Utilizando esta última relación para el proceso que nos interesa, esto es, recombinación dominante, encontramos un valor para el parámetro q_m en terminos de cantida des calculables a partir de la curva de termoluminiscencia y en consecuencia podemos evaluar la energía E. Este valor de q_m esta dado por;

$$q_{\rm m} = \frac{1.72 \ \mu m}{1 - \mu m} \left(1 - 1.58 \,\Delta \right) \tag{II-16}$$

donde $M_m = \frac{S}{W}$ (ver figura 5).

Finalmente, tenemos que el valor para la energía se calcula a partir de la relación

$$E = \frac{1.72}{z} kT_m^2 (1 - 2.58\Delta) \qquad (II-17)$$

en donde $\zeta = T_m - T_b$.

De esta expresión es claro que lo único que necesitamos para calcular la "profundidad de trampa" asociada con un pico de termoluminiscencia, cuyo máximo aparece a una temperatura T_m, son los valores de T_m mismo y de T_b.

La ventaja de este método es que solamente es necesa ria la primera parte del pico (hasta T_m) para el cálculo de la energía E. Por lo tanto, picos a mayores temperatu-ras, reales o espúreos, no afectan el valor de E calculado, a menos que esos picos modifiquen el valor de T_m .

CAPITULO III EXPERIMENTO.

Los cristales necesarios para los experimentos realiza dos en este trabajo se obtuvieron a partir de cloruro de sodio del tipo químicamente puro (fabricado por J.T. Baker Chemical Co.) utilizando el método de Kyropoulos. Las impu rezas, CaCl₂, MnCl₂, CdCl₂, CuCl₂, MgCl₂ y ZnCl₂ se incorporaron a la sal antes de cada crecimiento en concentra ciones de 0.5% a 1% en peso. Las condiciones para el crecimiento de los cristales han sido descritas ampliamente con anterioridad²⁶.

En lo sucesivo, a los cristales de cloruro de sodio sin impurezas adicionadas se les llamará B . También se utilizaron dos cristales de "alta pureza" de diferente pro cedencia, a uno de ellos se le llamará \mathbb{R}^{27} y al otre \mathbb{E}^{28} . Todas las muestras, tanto de los cristales puros como las de los cristales con impurezas intencionales, se cortaron por clivaje en una región perpendicular al eje de cristalización; esto se hace con el objeto de tener la menor v<u>a</u> riación posible en la cantidad de impurezas para las diferentes muestras de una misma región del cristal.

Para conocer cuantitativamente (en el caso de los - cristales con impurezas intencionales) el contenido de impurezas en cada muestra utilizada, se hizo un análisis por medio de espectrofotometría de absorción atómica de ca da región del cristal de donde se obtienen las muestras.

Un aspecto que se considera importante en este trabajo es el hecho de utilizar las mismas muestras, de una región dada de cada cristal, tanto para las mediciones de absorción óptica como para las de termoluminiscencia, lo cual asegura la comparación directa de los resultados. Se ha pensado que la diversidad de resultados en diferentes laboratorios se debe a que no se ha seguido un método para reportar condiciones experimentales que sean reproducibles. Este problema se presenta desde el momento de reportar, en el caso de irradiación con rayos X, que es el que nos int<u>e</u> resa, el voltaje y la corriente medidos en el aparato de rayos X, en lugar de dar la dosis recibida por el cristal, lo cual en principio es un punto de comparación.

Se trató que las muestras obtenidas de una región da-

da, en cada cristal, fueran todas aproximadamente de las mismas dimensiones, las cuales están limitadas por las dimensiones mismas de la platina calefactora del aparato de termoluminiscencia. Las dimensiones de las muestras fueron aproximadamente de 6.0x6.0x0.8mm³.

El primer paso para el experimento consistió en encon trar las condiciones para obtener repetibilidad en los resultados ya que, como se sabe, en este tipo de trabajos es común encontrar informes con gran dispersión. Primeramente. con varios cristales, se realizaron pruebas de tratamiento térmico inicial, esto es, se buscó la temperatura y el tiempo a que se deben mantener los cristales para tener la mayor consistencia posible en los resultados. El tratamien to térmico más adecuado resultó serel mantener los cristales a 650°C durante 30 minutos e inmediatamente enfriarlos. Este enfriamiento rápido se realizó depositando los cris tales (al sacarlos del horno de recocido a 650°C) directamente sobre una placa de cobre. Por las mismas razones, se tuvo especial cuidado de que la cara del cristal que queda en contacto con la placa de cobre, sea la que se expone al haz de rayos X, y esta cara irradiada es la que queda en contacto con la platina calefactora. Todo este proceso se realiza con pinzas para evitar el contacto de las muestras con los dedos.

Una vez que se logra repetibilidad en los resultados, se procede a la realización del experimento que consiste

esencialmente de tres partes para cada una de las muestras estudiadas: 1) irradiación con rayos X, 2) medición de absorción óptica y 3) medición de termoluminiscencia.

Irradiación X.- Se realiza con un aparato Philips tipo PW1010, con tubo de tungsteno y ventana de Berilio de -0.013mm de espesor. La muestra a irradiar se coloca a una distancia aproximada de 15mm de la ventana.

Debido a que se utilizaron durante todo el experimento rayos X blandos (operación del tubo a 20 KV, 20 mA) durante tiempos muy pequeños, de l a 16 minutos máximo, la coloración es más intensa en la superficie y tiene una dependencia aproximadamente exponencial con la profundidad. Por -este motivo se consideró con extremo cuidado el hecho de irradiar siempre la misma cara del cristal. Hay que tener presente que la cantidad de coloración que se obtiene en un material dado como función de la exposición a rayos X depende de: a) cada halogenuro alcalino en particular, b) la temperatura a la cual se realiza la irradiación y c) la pureza del cristal.

La irradiación se llevó a cabo teniendo en cuenta el punto b) mencionado anteriormente, para lo cual se tuvo es pecial cuidado en esperar el tiempo suficiente después de las medidas de termoluminiscencia y así irradiar siempre el cristal aproximadamente a la misma temperatura.

Absorción Optica, - Para realizar las medidas de ab--sorción óptica se utilizó un espectrofotómetro de doble -

haz marca Coleman modelo EPS-3T. Invariablemente los cristales irradiados se analizaron desde 340 mµ a 700 mµ obteniéndose siempre el máximo de absorción a 465 mµ (inde pendientemente de si el cristal fuese puro o con impurezas adicionadas) lo cual corresponde a la absorción caracterís tica de los centros F.

El experimento se llevó a cabo de manera que el haz luminoso fuese siempre normal a la cara irradiada del cris tal. Para esto, el cristal se coloca sobre una montura de aluminio con un agujero central de aproximadamente 5 mm de diámetro. El haz de referencia incide, tambien perpendicularmente, sobre una montura idéntica pero sin muestra en ella.

El espectrofotómetro es tal que nos permite graficar el porcentaje de transmitancia (relación de intensidad transmitida I a intensidad incidente I.) en función de la longitud de onda.

Aquí es conveniente establecer la forma en que calculamos, a partir de una gráfica de este tipo, la concentración de centros F. Se define la absorción α por la rela ción

$$d = -\frac{l}{l} \ln \frac{I}{I_0}$$
(III-1)

en donde l es el grueso del cristal. En la mayoría de los casos, el grueso de la región coloreada del cristal no se conoce y se utiliza entonces la relación:

$$A = -\log_{10} \frac{I}{I_0}$$
 (III-2)

en vez de la relación (III-1). Algunos autores utilizan lo que denominan densidad óptica, que se define como,

$$D.O. = \log_{10} \frac{I_{\circ}}{I}$$
(III-3)

calculando entonces, a partir de las gráficas, el valor p<u>a</u> ra (expresión (III-1)) y sustituyéndolo en la relación (I-1) obtenemos la concentración de centros F para un cri<u>s</u> tal dado.

En una misma gráfica ($\%\frac{1}{1_{\infty}}$ en función de λ) se obti<u>e</u> nen las curvas para la secuencia de irradiación X de 1, 2, 4, 8 y 16 minutos para un cristal dado. Como lo que nos interesa es la concentración de centros F a cada tiempo de irradiación sobre el cristal, es necesario obtener para c<u>a</u> da una de estas curvas la absorción óptica (definida en la página anterior (III-1)). Los valores de absorción debidos a la irradiación X se calculan normalizando a 100% de transmitancia y eliminando la línea base para lo cual utilizamos el método discutido por Konitzer y Markham²⁹. En la figura 6 se muestran para el cristal B las curvas de absorción para los diferentes tiempos de irradiación tal como se obtienen una vez que se ha realizado la corrección antes mencionada.

Termoluminiscencia. - En este caso el experimento con-



siste en medir los cambios que ocurren cuando el cristal previamente irradiado X se calienta gradualmente desde tem peratura ambiente (al menos en nuestro caso) hasta una tem peratura suficientemente alta.

Las médidas de termoluminiscencia se realizaron con un analizador Harshaw 2000. Este dispositivo consiste esencialmente de un detector de termoluminiscencia y un p<u>i</u> co amperímetro integrador (digital). El detector consiste de una placa calefactora que es a su vez el portamuestras (platina), los circuitos asociados al calefactor (con los cuales puede usarse rapidez de calentamiento lineal para la muestra desde temperatura ambiente hasta 400°C) y un t<u>u</u> bo fotomultiplicador refrigerado y estabilizado térmicame<u>n</u> te para asegurar baja corriente de fondo y alta estabili dad en ganancia. El picoamperimetro tiene intervalo de ca<u>m</u> bio automático (escalas) e integración de corriente autom<u>á</u> tica y, por medio de técnicas digitales, muestra directa mente el área bajo el espectro de termoluminiscencia.

Los cristales que se utilizaron en esta parte del experimento son los mismos, como ya se mencionó, que los ut<u>i</u> lizados para las mediciones de absorción óptica. Una vez que se ha irradiado una muestra y se ha medido su absor ción óptica, se coloca sobre la platina calefactora, te niendo la precaución que la cara irradiada sea la que esté en contacto con la platina y se procede a calentar lineal-

[†] Facilitado por el Laboratorio Nuclear del Centro de Materiales de la U.N.A.M.

mente la muestra a razón de 4.3 grados/seg, desde temperatura ambiente hasta 255°C. Durante este proceso se obtiene una gráfica de la intensidad de termoluminiscencia en función de la temperatura. Este experimento se realiza para cada tiempo de irradiación y para cada muestra.

Haciendo el análisis de estas gráficas con el método desarrollado en el capítulo anterior, es posible obtener la energía de la trampa o centro asociado con cada pico de termoluminiscencia. Estos resultados se presentan y discuten en el siguiente capítulo.

Con el objeto de identificar, en el espectro de termo luminiscencia de una muestra dada, cual de los picos co -rresponde a los centros F presentes en el cristal, se realizaron experimentos de "borrado parcial" de los picos de termoluminiscencia. El experimento consiste en calentar li nealmente la muestra irradiada hasta una temperatura ligeramente inferior a la que corresponde al máximo de un pico, de manera que este tratamiento disminuya apreciablemente el número de trampas ocupadas asociadas con ese pico, o bién, calentar la muestra a una temperatura suficiente para "vaciar" las trampas asociadas con un pico dado. Rela cionando los resultados de estos experimentos con las medi das de absorción óptica, es posible saber cuál pico es el asociado con centros F y cuál es la energía de la trampa.

Los resultados que se obtienen utilizando este método se discuten en el siguiente capítulo.

CAPITULO IV

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la figura 7 se muestran las curvas de crecimiento (densidad de centros F en función del tiempo de irradia--ción) para los cristales sin impurezas adicionadas, que hemos llamado B, E y R, y para los dos cristales con im-purezas cuyo comportamiento difiere más del de estos. De esta figura se puede ver que los resultados confirman la dependencia de las curvas de crecimiento de centros F con las impurezas adicionadas^{14,16-18}. Se observa que el cristal con impurezas de Ca²⁺ es al que corresponde la curva de crecimiento más alta, o sea, encontramos el resultado bién conocido^{14,16,17} que el Ca²⁺ favorece la formación de centros F. La curva más baja, con respecto a los cristales puros, corresponde al cristal con impurezas de Ca²⁺, re-sultado también conocido^{16,18}. En virtud de que la curva de





crecimiento para el cristal con impurezas de Cd²⁺ está por debajo de los correspondientes a los cristales puros, se puede afirmar que esta impureza inhibe la formación de cen tros F.

En la figura 8 se presentan las curvas de crecimiento para las seis impurezas divalentes estudiadas. Con el obje to de comparar con los cristales sin impurezas adicionadas, la región obscura corresponde a la que estos ocupan. De estos resultados es posible establecer el orden en que apa recen las curvas de crecimiento, tomando ahora como refe rencia el cristal con Cd²⁺. La secuencia, de menor a ma yor producción de centros F, es : Cd, Cu, Zn, B, R, Mg, E, Mn y Ca.

Es importante mencionar que el cristal E se obtiene a partir de NaCl de grado espectroscópico, mientras que el cristal R se obtiene a partir de la misma sal que la que se usa para obtener el cristal B (al menos desde el punto de vista de impurezas de "fondo"); la diferencia es que el cristal R se obtiene con técnicas especiales para evitar contaminación durante el proceso de crecimiento. Desafortu nadamente no nos fué posible conocer, cuantitativamente hablando, el contenido de todas las impurezas de "fondo" en estos cristales. De lo que podemos tener cierta seguridad, es que el cristal B es el menos puro de todos, puesto que no se usa ninguna técnica especial para eliminar o reducir el contenido de impurezas. El análisis del contenido de impurezas se realizó por medio de espectrofotometría por absorción atómica³⁰. El r<u>e</u> sultado para estos cristales se muestra en la tabla I, do<u>n</u> de los números indican partes por millón (ppm). La concentración de impurezas adicionadas en las muestras de los otros cristales estudiados también se determinó por este método, el resultado se presenta en la tabla II.

TABLA I

R	
8	
.5	
9	
1.3	

n.d. no detectado.

TABLA II

Impureza	adicionada	Ca	Cđ	Cu	超名	Min	Zn
Concentra	ación	3500	2450	1100	20	390	45

Del resultado de estos análisis, impurezas de fondo en los cristales e impurezas intencionales, se puede ver que aún en la situación más desfavorable, las impurezas intencionales son mayores por un factor 10³ (excepto el Mg) con respecto a las de fondo.

De los experimentos realizados para medir las caracte

rísticas termoluminiscentes de los cristales estudiados se observa (ver figuras 9 y 10) que, para los cristales R, E y B, se detectan dos picos de termoluminiscencia. Para el <u>cristal E</u>, el primer pico aparece a 360°K y el segundo a -450°K. El primero crece con el tiempo de irradiación hasta aproximadamente 8 mín. y después decrece. El segundo crece siempre con el tiempo de irradiación. Para el <u>cristal R</u> el primer pico aparece a 355°K, que crece hasta 3 minutos de irradiación y luego decrece. El segundo pico, 447°K, crece con el tiempo de irradiación. Por último para el <u>cristal B</u> se observa un comportamiento semejante al anterior. El pr<u>i</u> mer pico aparece a 355°K y el segundo a 461°K.

Entonces, para los cristales E, R, y B el pico de ter moluminiscencia de mayor temperatura (al menos para el intervalo estudiado en el presente trabajo) crece con el -tiempo de irradiación mientras que los de baja temperatura alcanzan un máximo y luego disminuyen. Este comportamiento también ha sido observado por otros autores^{31,32}. Otro pun to importante es que para estos cristales, la temperatura a la que aparece el primer pico es aproximadamente la misma (dentro del error experimental $\pm 5^\circ$).

Para los cristales con impurezas intencionales, el comportamiento de los picos está un poco menos dfinido. En el caso del <u>cristal Ca</u>, aparecen dos picos de termolumini<u>s</u> cencia, el primero a 390°K y el segundo aproximadamente a 444 °K. El primero crece inicialmente y aparentemente se sa



an Andrew

16 m





tura a partir de la minutos de irradiación; el comportamien to del segundo no se puede observar, puesto que no queda muy bien definido. Para el cristal Mn, el primer pico aparece a 355°K y decrece con el tiempo de irradiación; el se gundo a 395°K aumenta con el tiempo de irradiación. En el caso del cristal Mg, aparecen 4 picos que en orden de temper atura creciente son: 358°K, 385°K, 419°K y 461°K. De estos picos, el segundo y el tercero no están muy bien definidos. De esta misma figura 10 se observa que el primero disminuye a partir de tres minutos y el de más alta temperatura tiende a saturarse. Para el cristal Zn el primer pi co aparece a 349°K y decrece a partir de cuatro minutos; el segundo a 429°K crece con el tiempo de irradiación. El cristal Cu se comporta de manera muy semejante al Zn y los picos aparecen a 355°K y 419°K. El comportamiento del cris tal Cd es diferente, aquí los dos picos están a 338°K y otro a 368°K y crecen con el tiempo de irradiación.

De estos experimentos podemos concluir que los crist<u>a</u> les Mn, Zn y Cu se comportan, en cuanto al pico de mayor temperatura que se detecta, de manera muy semejante a los cristales sin impurezas adicionadas. Para los cristales -Ca, Mg y Cd el comportamiento parece no tener un patrón definido.

Sin embargo, si relacionamos estos resultados, con los que se obtienen utilizando el método de borrado par cial (discutido al final del capítulo III) con el cual po-

demos identificar cual pico de termoluminiscencia, en cada cristal estudiado, corresponde o está asociado con centros F y además utilizando el método desarrollado en el capítulo II para calcular la energía de activación (profundidad de trampa) asociada con cada pico, es posible obtener in formación valiosa acerca de la influencia de impurezas divalentes para el proceso de formación y crecimiento de ce<u>n</u> tros F.

Los resultados de los experimentos de borrado parcial y absorción óptica indican que, para todos los cristales estudiados, excepto Ca, el pico de termoluminiscencia que podemos asociar con centros F es el de mayor temperatura. Para el cristal Ca este pico es el de menor temperatura. -Esto se confirma observando que cuando se "borra" el pico de termoluminiscencia asociado con centros F el color en el cristal desaparece totalmente. Además, de esto último y los resultados de intensidad de termoluminiscencia mencionados anteriormente, vemos que en general el pico de termo luminiscencia que crece con la irradiación (excepto en el cristal Ca) corresponde al que podemos asociar con centros F.

En las figuras 11 y 12 se muestran las diferentes cur vas de termoluminiscencia que se obtienen cuando la misma dosis se aplica a cada uno de los cristales estudiados. En la figura 11 se nota claramente como el primer pico del cristal Ca es el más prominente mientras que el Cd inhibe





la termoluminiscencia. De gráficas de este tipo, para to dos los tiempos de irradiación, se determina la temperatura T_b y, siguiendo el método desarrollado en el capítulo -II, se calculan las energías asociadas con estos picos. -Los resultados se muestran en la tabla III en la cual los valores reportados indican la temperatura promedio para una serie de 10 medidas y la energía correspondiente. El error corresponde a una desviación estándar. Los valores de E subrayados corresponden al pico asociado con centros F.

TABLA III

	T(°K)	E(eV)	T(°	K)	E(eV)	T(°	K) E(eV)
Cristal	760	1 76+0 08				1.20	1 22to 16
R	355	1.49±0.18				野	1.22±0.10
BCa	355	1.57±0.14	390	0.5	8±0.08	461	1.22±0.15
Cd	338	1.26±0.13	368	1.6	7±0.12	1,19	1.20+0.14
Mg	358	1.54±0.12	705		0-+0 11	461	1.29±0.12
Zn	349	1.56±0.11	272	Tel	17-0.11	429	1.29±0.10

CONCLUSIONES.

En conclusión, para la secuencia de formación de centros F que se había propuesto al principio del presente ca pítulo, en virtud de los resultados de absorción óptica y tomando en consideración los resultados presentados en la tabla III, podemos ahora asignar a cada cristal estudiado una energía para el pico de termoluminiscencia asociado - con centros F de la siguiente manera: Cd (1.67), Cu (1.29), Zn (1.29), Mg (1.29), B (1.22), R (1.22), E (1.22), Mn -(1.09), Ca (0.58). De aqui observamos que la trampa asocia da con Ca, que es el que más favorece la creación de cen tros F, es la de menor energía, y la asociada con la im pureza que más inhibe la formación de centros F es la que tiene mayor energía.

Debido a que la energía de activación del pico de ter moluminiscencia que "borra" centros F, para todos los cris tales estudiados, es siempre menor que la energía del primer estado excitado del centro F (las medidas de absorción óptica indican que este estado excitado tiene una energía de 2.7 eV con respecto al estado base) proponemos que es tas energías de activación estan asociadas con trampas de agujeros, las cuales al "vaciarse" propiciarán, por recombinación, el aniquilamiento de centros F causando el decre mento observado en la absorción óptica. De esto se sugiere la conclusión que el factor determinante en la formación y crecimiento de centros F, en presencia de impurezas diva lentes, son las trampas de agujeros introducidas por estas impurezas.

Aunque el modelo propuesto está respaldado por los re sultados experimentales, el mecanismo no está del todo cla ro, y su esclarecimiento nos permitirá entender la razón por la cual algunos de los picos de termoluminiscencia que afectan la banda F se satura, mientras que otros, aparente

mente, crecen con el tiempo de irradiación. Es obvio que para darle la mayor validez posible al modelo propuesto, es necesario más trabajo experimental. Por ejemplo, un experimento podría ser tratar de identificar el signo de las partículas asociadas con las trampas. Posiblemente la utilización del efecto H all ayude a esto, aunque desde luego, la realizabilidad será función del tiempo de vida de los portadores en las bandas y de las densidades de población en las trampas.

Sin embargo, el trabajo aquí presentado, permite est<u>a</u> blecer una correspondencia entre la energía de la trampa y su influencia en la formación y crecimiento de centros F, o sea, dado un pico de termoluminiscencia (el "borrado" del cual inhiba la banda F) con una energía de activación bien definida, se puede predecir la influencia que este p<u>i</u> co tendrá en la formación y crecimientos de centros F re sultando que, hasta ahora, no se ha reportado en la liter<u>a</u> tura.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al --Dr. Edmundo de Alba por su interés y esclarecedoras dis-cusiones. Al Fís. Hector Riveros y al M. en C. Ariel A. Valladares les agradezco sinceramente su inestimable colaboración, desde la planeación del trabajo, hasta la conclusión del mismo. Por último quiero agradecer a mi -Esposa su constante estímulo y su incansable labor mecanográfica.

REFERENCIAS

- 1.- J.H. Schulman y W.D. Compton, Color Centers in Solids Pergamon Press (1962).
- 2.- J.J. Markham, F Centers in Alkali Halides, Academic Press (1966).
- 3.- C. Kittel, Introduction to Solid State Physics (3a. Ed) J. Wiley (1967).
- 4.- F. Seitz, Revs. Mod. Phys. 26, 7 (1954).
- 5.- G.R. Cole y R.J. Friauf, Phys. Rev. 107, 387 (1957).

6.- W. Hayes y G.M. Nichols, Phys. Rev. 117, 993 (1960).

- 7.- J.H. de Boer, Receuil Trav. Chim Pays-Bas, <u>56</u>, 301 (1937).
- 8.- A.F. Kip, C. Kittel, R.A. Levy y A.M. Portis, Phys. Rev. 91, 1066 (1953).
- 9.- G. Feher, Phys. Rev. 105, 1122 (1957).
- 10.-A. Smakula, Zeits. fur Physik, 59, 603 (1930).

11.-D.L. Dexter, Phys. Rev. 101, 48 (1956).

12.-R.B. Gordon y A.S. Nowick, Phys. Rev. <u>101</u>, 977 (1956). 13.-P.V. Mitchell, D.A. Wiegand y R. Smoluchowski, Phys. -

Rev. 121, 484 (1961).

- 14.-H.W. Etzel, Phys. Rev. 87, 907 (1952).
- 15.-M. Ikeya, N. Itoh, T. Okada y T. Suita, J. Phys. Soc. of Japan 21, 304 (1966).

16.-S.C. Jain y D.C. Parashar, Phys. Letters 4, 36 (1963).

- 17.-J.E. Caffyn y B.K. Ridley, Proc. Phys. Soc. (London) <u>77</u>, 153 (1961).
- 18.-S.C. Jain, G.D. Sootha y R.K. Jain, J. Phys. C (Proc. Phys. Soc. London) <u>1</u>, 1220 (1968).
- 19.-J.H. Crawford y C.M. Nelson, Phys. Rev. Letters 5, 314 (1960).
- 20.-J.T. Randall y M.H.F. Wilkins, Proc. Roy. Soc. (London) <u>A184</u>, 366 (1945).

21.-H.E. Klasens y M.E. Wise, Nature 158, 483 (1946).

- 22.-Ch.B. Luschik, Doklady Akad. Naak. SSSR 101, 641 (1955).
- 23.-A. Halperin y A.A. Braner, Phys. Rev. <u>117</u>, 408 -- (1960).

24.-N.F. Mott y R.W. Gurney, Electronic Processes in Ionic Crystals, Oxford University Press, Pág. 108 (1948).

- 25.-G. Bonfiglioli, P. Brovetto y C. Cortese, Phys. Rev. <u>114</u>, 951 (1959).
- 26.-E. Muñoz P. Tesis Profesional, Fac. de Ciencias, UNAM (1962).

- 27.-Cristal cedido por el Prof. Rosenberger de la Universi dad de Utah. Este cristal se obtiene a partir de la substancia químicamente pura, utilizando métodos especiales para no contaminarlo durante el crecimiento.
- 28.-Cristal cedido por la Srita. E. de Laredo, crecido a partir de sal de grado espectroscópico en el I.V.I.C. Caracas, Venezuela.
- 29.-J.D. Konitzer y J.J. Markham, J. Chem. Phys. <u>32</u>, 843 (1960).
- 30.-H.G. Riveros, Comunicación Personal.
- 31.-F. Urbach y G. Schwartz, Wien. Ber. (IIA) <u>139</u>, 483 (1930).

32.-J.J. Hill y P. Schwed, J. Chem. Phys. 23, 652 (1955).